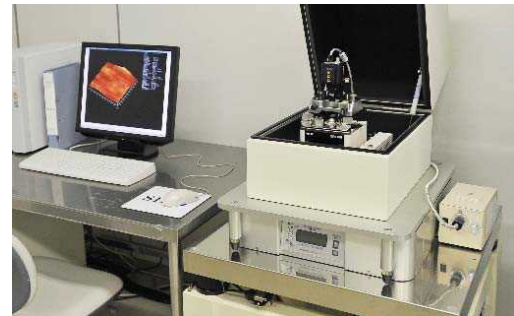


走査型プローブ顕微鏡 (AFM) (SII : SPA-400)

微小部の三次元ナノメートルオーダーの形状と機械物性、電気物性を同時に計測するシステムです。表面電位分布や、粘弾性分布、摩擦特性分布が計測できます。

面内0.2nm、垂直0.01nmの分解能を有しています。



【仕様】

制御部	NanoNaviステーション
本体	多機能型ユニット SPA-400
検出系	光てこ方式
試料サイズ	35mmφ、10mm厚
スキャナー	オープンループ XY: 20μm/Z:1.5μm クローズループ XY: 110μm/Z:6μm
測定モード	AFM、DFM他
ホルダー	AFM、DFM、VE-KFM

設置場所 C10棟 302室

カテゴリー 観察